



中心系列讲座 ICQM Weekly Seminar Series

“拓扑绝缘体的输运性质研究”



Professor Yongqing Li 李永庆
Daniel C. Tsui Laboratory,
Institute of Physics, CAS

Time: 4:00pm, Mar. 2, 2011 (Wednesday)

时间: 2011年3月2日 (周三) 下午4:00

Venue: Room 607, Conference Room A, Science Building 5

地点: 理科五号楼607会议室

摘要

本报告将首先综述三维拓扑绝缘体输运性质的国际研究现状，然后介绍我们与物理所吴克辉小组合作，在拓扑绝缘体薄膜生长、化学势及输运性质调控等方面取得的一些实验进展。报告的重点将是利用反弱局域这一量子输运现象实现对表面态输运的甄别。报告还将讨论此类材料中的电子与电子相互作用及其物理后果。